

| 設備No | 装置名                      | 機種   | 利用料/H<br>(税込) | 技術代行料<br>(税込) |
|------|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 1-1  | X線光電子分光分析装置              | アルバック・ファイ社製 ESCA 5800  | 2200          | 24000/件       |
| 2-1  | 電子状態測定システム               | 島津製作所社製 AXIS-ULTRA   | 2700          | 5800/1H       |
| 3-1  | 動的二次イオン質量分析測定装置          | Analysetechnik GmbH社製ATOMIKA SIMS 4000   | 1500          | 3900/1H       |
| 4-1  | 表面・界面分子振動解析装置            | 東京インストルメンツ社製Spectra-Physics  | 1400          | 4500/1H       |
| 5-1  | 高速レーザーラマン顕微鏡             | ナノフoton Raman-touch  | 2000          | 4900/1H       |
| 5-2  | レーザーラマン分光光度計 NRS-2000    | 日本分光社製NRS-2000   | 3300          |               |
| 5-3  | プローブ型顕微ラマン分光測定装置         | カイザーオプティカルシステムズ製RAMAN RXN Systems  | 1600          | 4600/1H       |
| 6-1  | レーザーラマン分光光度計 NRS-3100    | 日本分光社製 NRS-3100KK  | 2300          | 4900/1H       |
| 7-1  | UV-Vis-NIR分光光度計          | 島津製作所社製SolidSpec-3700DUV   | 600           | 3600/1H       |
| 7-2  | 中赤外・遠赤外吸収測定装置            | パーキンエルマージャパン製 Spectrum400 FT-IR/FIR SpotLight400 IRイメージング                                | 670           | 3800/1H       |
| 8-1  | 紫外可視近赤外分光測定装置            | 日本分光社製V-670  | 1500          | 4400/1H       |
| 9-1  | 超高速HPLC分離・分子構造分析システム     | 島津製作所nexeraX2(114)、Bruker micrOTOF-QIII(114)、日本分光J-1500(113)、大塚電子 DLS-8000DL(113)        | 1900          | 4800/1H       |
| 10-1 | 近赤外蛍光分光装置 Fluorolog-NIR  | 堀場製作所社製 Fluorolog-NIR  | 1500          | 4100/1H       |
| 11-1 | 近赤外蛍光分光装置 NanoLOG-EXT    | 堀場JOBIN YVON社製NanoLOG-EXT  | 1000          | 4000/1H       |
| 12-1 | シングルフォトンカウンティング蛍光寿命計測装置  | 浜松ホトニクス社製  | 1200          | 4100/1H       |
| 13-1 | 核磁気共鳴測定装置                | Bruker社製 Avance 500MHz   | 940           | 1500/件        |
| 14-1 | 質量分析装置                   | JEOL社製 JMS-T100CS  | 680           | 2700/1H       |
| 15-1 | MALDI-TOF質量分析装置          | BRUKER社製 Autoflex III  | 1700          | 4500/1H       |
| 15-2 | 分離用小型超遠心機                | 日立工機社製CS100GXL   | 330           | 3300/1H       |
| 15-3 | 分取HPLCシステム               | 日本分析工業社製LC-908-C60   | 4200          | 7200/1H       |
| 16-1 | 走査型プローブ顕微鏡 PicoPlus 5500 | アジレントテクノロジー社製 PicoPlus 5500  | 570           | 3200/1H       |
| 16-2 | 表面抵抗率計                   | 三菱化学社製 Loresta-GP  | 830           | 3800/1H       |
| 16-3 | 表面形状測定装置                 | Veeco社製Dektak 6M   | 750           | 3200/1H       |
| 17-1 | 走査型プローブ顕微鏡 SPM9600       | 島津製作所社製SPM9600   | 1200          | 4100/1H       |
| 17-2 | 走査型プローブ顕微鏡測定システム         | Veeco社製nanoscopeIIIa   | 2500          | 5400/1H       |
| 18-1 | 環境制御型ユニット付き多機能走査型プローブ顕微鏡 | エスアイアイ・ナノテクノロジー社製SPA300HV  | 820           | 3300/1H       |
| 19-1 | 環境制御型多機能走査型プローブ顕微鏡       | エスアイアイ・ナノテクノロジー社製SPI3800N  | 380           | 3500/1H       |
| 20-1 | 超高分解能走査電子顕微鏡             | 日立ハイテクノロジーズ SU9000   | 1500          | 4500/1H       |
| 20-2 | 3次元SEM画像測定解析システム         | KEYENCE VE-9800  | 1100          | 4000/1H       |
| 21-1 | 走査型電子顕微鏡 S-5000          | 日立社製 S-5000  | 1900          | 4500/1H       |
| 22-1 | 透過型電子顕微鏡システム             | 日本電子社製 JEM-2010  | 880           | 3800/1H       |
| 22-2 | マイクロ構造観察電子顕微鏡システム        | 日本電子社製 大気圧走査電子顕微鏡 JASM-6200  | 2900          | 6000/1H       |
| 23-1 | ゼータ電位/粒径測定システム           | 大塚電子ELS-Z  | 1100          | 4100/1H       |
| 24-1 | ゼータサイザーゼータ電位・粒子径・分子量測定装置 | マルバーン社製Nano ZS   | 2200          | 6200/1H       |
| 25-1 | 動的光散乱測定装置                | Malvern社製 Zetasizer Nano ZS  | 960           | 4000/1H       |
| 26-1 | 全自動水平型多目的X線回折装置          | リガク社製SmartLab  | 2300          | 5200/1H       |
| 27-1 | 単結晶X線構造解析装置              | Bruker社製 SMART APEX  | 3200          | 36000/件       |
| 28-1 | マイクロカロリーメーター             | MicroCal社 VP-ITC   | 2500          | 5400          |
| 28-2 | 蒸気圧式絶対分子量測定装置            | Gonotec社製 OSMOMAT 070  | 260           | 2900/1H       |
| 28-3 | 蒸気圧式分子量測定装置              | KNAUER社製Vapor Pressure Osmometer K-7000  | 260           | 3400/1H       |
| 29-1 | 分子構造解析システム               |  | 320           | 3300/1H       |
| 30-1 | ナノ炭素燃料電池評価システム           | 東陽テクニカ社製(自動CV型燃料電池評価システム AutoPEM-ER02型、燃料電池評価システム AutoPEM-ER01型 テスター産業 高精度ホットプレス SA-501) | 340           | 3400/1H       |
| 30-2 | 触媒活性表面測定システム             | 日本ベル社製 自動批表面積/細孔分布測定装置 BELSORP-mini II 触媒分析装置 BELCAT-B                                   | 390           | 3500/1H       |
| 31-1 | 太陽電池特性評価システム             | 分光計器社製 SRO-25GD  | 4300          | 8200/1H       |